Otsuka 大塚電子株式会社

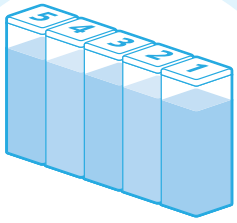
NEW

Multi-Sample Nanoparticle Size Measurement System

多検体ナノ粒子径測定システム

nanoSAQLA

品質管理に最適
標準規格に準拠



5検体連続

この1台で高速・手軽に
5検体連続測定ができる

動的光散乱法

粒子径
0.6nm~10μm

濃度範囲 0.00001 ~40%

希薄～濃厚系

希薄溶液から
濃厚溶液まで対応

測定現場にやさしさをプラス

こんなにできて
低コスト。

コンタミレス

洗う手間なし、
コンタミレスを実現

温度範囲 0~90℃

バッチ測定時

温度グラジエント

幅広い温度に対応

省スペースで
"室内なじみの良さ"を
追求した
シンプルボディ

PICKUP

「安心」を支える
品質管理の現場に寄り添う

操作もフォルムも、
やさしい。

かんたん測定機能

1click

連続測定

1クリックで測定できる
「かんたん測定機能」搭載

「高性能」と「使いやすさ」を両立

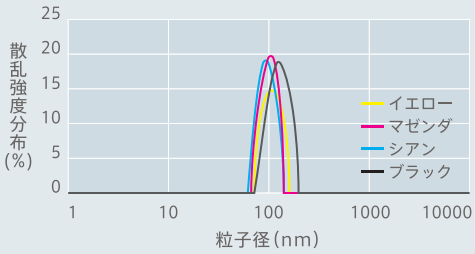
nanoSAQLA

5検体連続測定がこの1台で可能、かつコンタミレス

オートサンプラーなしでは難しかった
複数検体の連続測定を実現しました。

測定例

プリンタ用インク（有機顔料）の粒度分布



原液あるいは原液に近い状態での測定が可能。

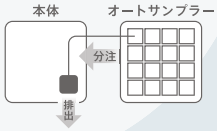
nanoSAQLA だけの ポイント

各セルが独立しているため
コンタミの心配がありません。

・洗う手間なし、手軽
・コンタミレス

nanoSAQLA
- 溶液を分注しない
- セルが独立
（ディスポセルも対応）

一般手法
- 分注式（フローセル）

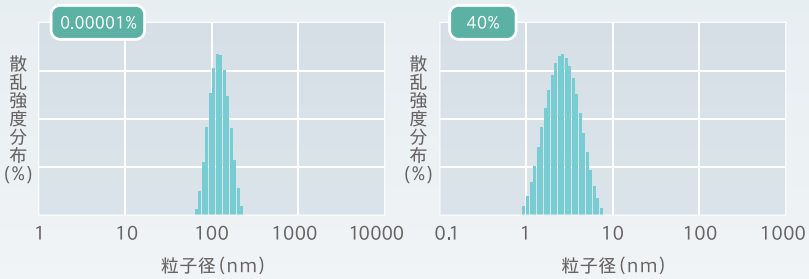


希薄から濃厚系に対応

幅広い濃度範囲を短時間で測定可能です。
（高感度センサー採用により、従来に比べ測定時間の短縮を実現）

測定例

ポリスチレンラテックス 120nm（0.00001%）、タウロコール酸（40%）の粒度分布

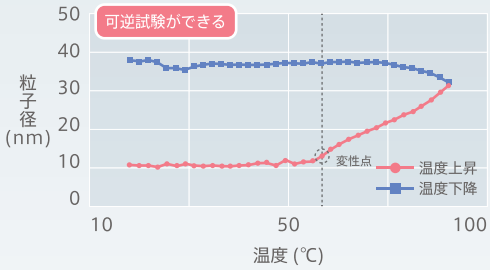


幅広い温度に対応

幅広い温度範囲で、温度による
サンプルの変性を評価できます。

測定例

牛血清アルブミン（BSA）の粒子径の温度依存性



Specification 仕様

測定原理	動的光散乱法
光源	高出力半導体レーザー *1
検出器	高感度APD
連続測定	5検体
測定範囲	0.6nm～10μm
対応濃度	0.00001～40％ *2
温度	0～90℃（温度グラジエント機能あり）*3

規格	ISO 22412:2017 準拠 JIS Z 8828:2013 準拠 JIS Z 8826:2005 準拠
サイズ	W240×D480×H375mm
重量	約18kg
ソフトウェア	平均粒子径解析（キュムラント法解析）
	粒度分布解析 （Marquardt法/NNLS/Contin法/Unimodal法）

ソフトウェア	粒度分布重ね書き
	逆相関関数・残差プロット
	粒子径モニター
	粒子径表示範囲（0.1～10^6nm）
	分子量計算機能

*1 本装置はレーザーに関する安全基準(JIS C 6802)のクラス1に区分される製品です。
*2 Latex120nm：0.00001～10%、タウロコール酸：～40%
*3 標準ガラスセルでのバッチ測定の場合。
ディスポセルや連続測定時は 15~40℃(温度グラジエント非対応)。

大塚電子株式会社

■大阪本部・営業部　TEL.(06)6910-6522　FAX.(06)6910-6528
〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通3丁目1-2 エスリードビル大手通6 F

■東京支店　TEL.(042)644-4951　FAX.(042)644-4961
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル4 F

■東北営業所：TEL.(022)208-9645　FAX.(022)208-9675
■九州営業所：TEL.(092)717-3338　FAX.(092)717-3339
■東海営業所：TEL.(052)269-8477　FAX.(052)269-8478

HP
http://www.otsukael.jp/

ご質問・ご相談など
お気軽にお問い合せ下さい

18.01.23